

2013.07.04 BEANSプロジェクトセミナー



伊藤寿浩 産業技術総合研究所・集積マイクロシステム研究センター





Macro BEANSの全体像



anced Industrial Science and Technology AIST





研究概要

非真空・大面積に対応するために

AIST







成膜原理 プラズマ化学輸送法

 H_2 、シリコンターゲット使用 (SiH₄フリー)





anced Industrial Scie and Technology AIST







超高周波(150 MHz)による成膜速度高速化(最高118 nm/min)を実現



成膜速度の水素濃度依存性

ンリコン
腹町面SEM 「シリコン基板上)

構成材の低誘電率化と下部電極GND強化により電力損失を抑制し、安定放電を実現 150MHz電源を用いた成膜により膜厚均一性±10%以下,電子移動度 1.32 cm²/Vs, 成膜速度 118 nm/分を達成





固体ソースによる荷電子制御プロセスを開発~ドーパントがターゲット 中の濃度に比例してドープされることを確認



P(B-doped)/N(P-doped)型で導電率10⁻¹Ωcmを達成















特長

- 1. 超音波エネルギーの利用により平均粒径数 µ mのSi粒子群(ミスト)を連続的に吐出可能 → 機能膜の均質化
- 2. 吐出径が小さいため、Si微粒子分散液の蒸発が早い









3層混合膜 Si膜(0.6um)/Si粒子/Si膜(0.3um)/基板





局所環境 雰囲気制御技術の開発

 開放系で擬似的な密閉清浄空間を形成

 ◆反応ガスの外部への漏洩防止
 ◆大気成分の内部への侵入防止

 X自のガスカーテン構造

 ・カーテンガスを排気の外周に設ける

・ヘッド下面を陽圧にする流量制御

and Technology AIST

①ガス流量設定への流体シミュレーション活用 ②実機による検証(ガス分析)



適正ガス流量値 排気流量が適正値の1/2 100 100 90 80 90 (vol.%) (%.lov) 80 カーテンガス 70 70 He - He 吐出口 反応ガスの 60 60 Ar ⁼Ar 50 40 相対濃度 50 40 相対濃度 外部漏洩 N₂ Ν, 2 -×-0 **0**₂ 30 30 1. 20 20 反応ガス 排気口 10 10 叶出口 0 2 3 6 2 4 5 測定点 1 5 6 4 1 3 測定点

ガスカーテン構造による擬似的な密閉清浄空間の形成を実証

I. ITON, UMEMSME/AIST









<u>ガスカーテン構造</u>



Si膜のSEM写真とXRD測定結果







(1) 大気圧プラズマ成膜

✓超高周波(150 MHz)による成膜速度高速化(最高118 nm/min)を
 実現

✓固体ソースによる荷電子制御プロセスを開発~ドーパントがターゲット 中の濃度に比例してドープされることを確認

✓ 歪抵抗効果デバイス:従来の低圧CVD膜と同等のゲージ率(≒40)を

確認、光電変換デバイス:整流性、発電性が生じることを確認

(2) ナノ材料均質塗布技術

大気圧プラズマシリコン単膜と同等性能の混合膜を実現

(3)局所環境制御技術

ガスカーテン構造により、Si膜形成が可能な局所清浄環境を実現 ⇒世界で初めて開放型大気圧プラズマによりSi成膜に成功、密閉型機と同 等(多結晶構造、成膜速度/13.56MHz)のSi成膜を実現



繊維状基材連続微細加工・集積化プロセス技術開発



nano

anced Industrial Sc and Technology AIST

繊維状デバイスの高速連続製造工程



【繊維状デバイスに求められる要素】 ・高速かつ連続的な機能性薄膜形成 ・高速かつ連続的なパターン形成 ・可動接点構造形成

- 【基本プロセス】
 - ・高速ダイコーティング技術
 - ・連続インプリント技術
 - ・連続露光プロセス
 - ・インクジェット
 - ・中空基材内への構造形成













コーティング成膜プロセス



巻き取った成膜済基材 (PET,幅5mm)



Macro BEANS Center





・太陽電池材料の成膜にプロセスを適用







試作フレキシブル発電シート



Macro BEANS Center







AIST

Thickness measurement of die coated films

基板の厚さばらつき数µmに対応可能 な液圧制御による高速膜厚制御手法 ⇒100 nmレベルの薄膜を±5%で成膜











National Institute of anced Industrial Science and Technology AIST

Macro BEANS Center





円筒モールドによる複合パターンの一括転写に成功!







POF表面の成形パターン

Macro BEANS Center



















BEANS

Electronic Textile用接点構造





S.Khumpuang, et al: IEEE MEMS-2011



R2Rディスペンシングによる接点構造形成

NS







機能膜形成・加工した機能性繊維状基材をアライメントし,低摩擦で素子 機能を破壊しないように連続製織(大面積化)できるプロセスを開発













- (1)機能薄膜連続被覆
- ✓ 100 nmレベルの薄膜を膜厚変動±5%以内で成膜可能
- ✓ 代表的な機能性薄膜について、基材搬送速度50 m/minの成膜を実現
- (2)連続微細加工
- ✓ 20 m/minの高速熱ローラーインプリントを実現
- ✓ 3次元露光システムによる最小2 μmパターンのリソグラフィープロ セスを開発
- マイクロスケール混相流を応用する細管基材内構造形成技術を開発 (3) 製織集積化
- ✓ 20 m/minのシリコンエラストマー接点構造製造プロセスを開発
- ✓ 自動織機(ウィービング装置)による6種類のメートル級フレキシブ ルデバイスを試作









ukuba Innovation Arena

and Technology AIST